媒質が装荷された厚みのある導体スリットによる平面波回折

Plane Wave Diffraction by a Loaded Thick Slit

電気電子情報通信工学専攻 清水 将行 Masayuki SHIMIZU

1. まえがき

無線通信技術の発展に伴い,建物内部におけるスマー トフォン等のモバイル通信端末の利用機会が増加してい る.屋内において安定した無線通信を実現するためには, 建物の壁や窓を通した屋外屋内間の伝搬特性の解析が重 要となるが,電磁波は周波数が高くなるにつれ,建物壁 のコンクリートを通過する際の減衰が激しくなる.その ため,開口部である建物壁に設けられた窓が,主要な伝 搬経路となることが考えられる.そこで,窓を厚みのあ るスリットと見なし,スリットによる電磁波の散乱を解 析することで,窓を通した伝搬特性を知ることができる と考えられる.

厚みのない導体平板上に設けられたスリットによる回折 は、典型的な電磁波散乱問題の一つであり、様々な解析が行 われている [1–3].開口幅が比較的広い場合、厚みのないス リットによる回折は、開口端における二つのエッジ回折の みを考慮すればよいため解析が比較的容易であり、幾何光 学的回折理論(Geometrical Theory of Diffraction; GTD [4])が有効な手法として知られている [2].一方でスリッ トが厚みを持つ場合、厚みがない場合に比べ解析が難し く、KP 法を用いた解析 [5] などが行われているが、これ らの解析では開口幅が比較的狭いスリットについての問 題を扱っている.

以上のような背景のもと、本研究では開口幅が波長に 対して広い場合に有効である高周波漸近解法を用い、厚 みのあるスリットによる平面波回折を考える.スリット 内部に関しては光線・モード変換[6]を適用し、平行平板 導波管モードを用いる.この手法を用いた解析はすでに 行われており[7]、開口間での多重エッジ回折、減衰波と なるより高次の非伝搬モードの寄与を考慮することによ り、解析精度の向上が確認されている[8].本研究ではこ れらの解析を、窓ガラスを想定した媒質がスリット内部 に装荷されている場合に拡張して定式化を行う.そして、 数値計算結果を他の手法による結果と比較することによ り本手法の妥当性を検証する.また、窓モデルを用いた 数値計算を行い、実際の窓を想定した回折パターンの解 析を行う. 以下の解析では時間調和因子 $e^{-i\omega t}$ を用い,これを省略する.

問題の定式化

図1に示すように, E 偏波の平面波 u^i :

$$u^{i} = E^{i}_{u} = e^{-ik(x\cos\theta_{0} + z\sin\theta_{0})} \tag{1}$$

が、開口幅 a、厚み b の導体スリットに入射した場合を考 える. ここで k は自由空間中の波数であり、比誘電率 ε_r , 比透磁率 μ_r , 厚み $b_2 - b_1$ (> 0)の媒質がスリット内部 に部分的に装荷されているとする.まず、解析の便宜上 解析空間を、スリットの照射側(Reg. II)、スリット内部 (Reg. II)、スリットの回折側(Reg. III)の三つの領域に 分割する.入射波である平面波がスリット上部開口端の エッジ ($x = \pm a/2, z = 0$)に入射することにより、Reg. I へ放射する回折波が生成され、Reg. II へ導波管モードが 励振される.この主要回折波 u_0 はスリット上方の界にお ける寄与が大きく、観測点 (ρ , θ)における遠方界は GTD を用いて

$$u_0 = u_0^+ + u_0^- \tag{2}$$

$$u_0^+ \sim C(k\rho) D_{-1} \left(\theta, \theta_0; \frac{3}{2}\pi\right)$$
$$\cdot e^{-ika(\cos\theta + \cos\theta_0)/2} \tag{3}$$

$$u_0^- \sim C(k\rho) D_{-1} \left(\theta + \frac{\pi}{2}, \theta_0 + \frac{\pi}{2}; \frac{3}{2}\pi \right) \\ \cdot e^{ika(\cos\theta + \cos\theta_0)/2}$$
(4)

と書くことができる. ここで, $C(\chi) = (8\pi\chi)^{-1/2}e^{i(\chi+\pi/4)}$ は二次元自由空間におけるグリーン関数の遠方近似界で あり, $D_{\tau}(\phi, \phi_0; \phi_w)$ は開き角 ϕ_w の完全導体ウェッジに対 する Keller の回折係数である [4]. 個々の回折波 u_0^+ , u_0^- は影境界 (Shadow Boundary; SB) となる $\theta = \pi - \theta_0$ 付 近において発散傾向を示すが,回折波の足し合わせであ る u_0 (= $u_0^+ + u_0^-$)は,極限を取ることにより二つの特 異性は相殺され有限値となる [7].

また,開口端においては左右エッジ間での多重エッジ 回折が生じ,開口幅が比較的狭い場合この影響は無視す ることができない.この影響も主要回折波と同様にGTD により定式化し,多重エッジ回折の寄与を含めて,スリッ



図 1: 解析モデル図

ト上端の開口で励振される主要回折波 *ū*₀ を求めることが できる [8,9].

入射波により上部開口端で励振された回折波の一部は, スリットの内部である Reg. II へ伝搬し,反射,回折など の多重散乱を経て,再びスリット外部へと放射される.ス リットの開口幅が波長に比べ十分に大きいと仮定すると, これらの界は光線の足し合わせで表現することができる. しかし, Reg. II では,入射した回折波がスリット内部の 管壁によって多重反射するため,光線和の収束が非常に 遅く光線表示は望ましくない.そこで,収束の速い導波 管モードを得るため,開口において光線・モード変換を 適用する [6].

スリット上部の開口端では,入射波により Reg. I へ放 射される主要回折波が生成され,それと同時に Reg. II へ z 軸負方向へ伝搬する導波管モード *i*:

$$\dot{u} = \sum_{m=1}^{\infty} A_m U_m^- \tag{5}$$

が励振される. A_m はm次のモードの振幅であり, U_m^{\pm} は 平行平板導波管モード:

$$U_m^{\pm} = \sin\left\{\frac{m\pi}{a}\left(x + \frac{a}{2}\right)\right\}e^{\pm i\zeta_m z} \tag{6}$$

である. $\zeta_m = \sqrt{k^2 - (m\pi/a)^2} = k \cos \theta_m$ は z 軸方向 におけるモードの伝搬定数であり、モード伝搬角 θ_m は $m \le ka/\pi$ のとき

$$\theta_m = \sin^{-1} \left(\frac{m\pi}{ka} \right) \tag{7}$$

となる. $m > ka/\pi$ で励振される導波管モードは,伝搬 定数 ζ_m が純虚数になるため,それに対応する U_m^\pm は非伝 搬モードとなり伝搬するにつれて急激に減衰する.この 場合,式(7)で示したモード伝搬角を複素数へ拡張する ことにより,非伝搬モードの計算が可能となる.複素数 へ拡張したモード伝搬角を $\hat{\theta}_m$ とすると

$$\hat{\theta}_m = \frac{\pi}{2} - i \cosh^{-1}\left(\frac{m\pi}{ka}\right) \tag{8}$$

となる [10].

上部の開口端において励振された導波管モードは,ス リット内部を下方向に伝搬し,装荷された媒質へ入射す る.内部に異媒質が装荷されている場合,無限長導波管 と仮定することにより,媒質表面における境界条件を用 いて各散乱係数を導出することができる.光線・モード変 換を適用したことにより,これらの散乱はモードの反射・ 透過として扱うことができるため便利である.媒質を透 過したモードは下部開口端に入射し,これにより Reg. III へ再放射される回折波,再び内部を上方向へ伝搬する導 波管モードが励振される.これらの再放射界は文献 [7,8] と同様に,スリット開口端における導波管モードの励振, 結合,ならびにスリット外への再放射を表現した行列の 組合せで簡単に表記することができるが,行列式及び行 列要素の具体的な記述は,紙面の都合上割愛する.

3. 数値計算結果及び考察

最初に,他の手法による解析結果との比較を行う.比 誘電率 $\varepsilon_r = 3.00$,比透磁率 $\mu_r = 1.00$ をもつ損失のな い誘電体が開口内部全体に装荷されたスリットに, E 平 面波が入射角 $\theta_0 = 50.0^\circ$ で入射したときの遠方回折界を 図 2 に示す. 厚みを kb = 2.00 とし, 開口幅はそれぞれ (a) ka = 7.00, (b) ka = 30.0 である.以降,回折界の計 算では共通となる C(kρ) を除いた界を示す.本手法によ る結果をGTDとし、開口端の左右エッジ間における多重 エッジ回折の寄与及び、非伝搬モードの寄与を考慮した 結果を emGTD, 多重エッジ回折の寄与を考慮した結果 をmGTD,一次エッジ回折のみを考慮した結果をsGTD とする.また、小林ポテンシャル法による結果 [5] を参照 解とし、これを KP とする. 両者の場合とも KP とよい 一致を示し,誘電体が装荷されていない場合の結果 [8] に 比べ、減衰波である非伝搬モードの影響が大きいことが わかる.誘電体内部では伝搬定数が異なり、しゃ断周波 数の条件が変化する. そのため, 誘電体が装荷されてい ない場合に比べてしゃ断周波数に近い非伝搬モードの寄 与が重要となると考えられる.図3は損失のある誘電体 $(\varepsilon_r = 3.00 + i4.00)$ が装荷されている場合の結果である. 誘電体が虚部をもつため伝搬中に損失が生じ, スリット 内を伝搬して下方へ放射する波は非常に弱くなる. 比誘 電率を虚数とした場合でも精度の良い結果となった.

以上のように, KP 法と比較することによって本解析手 法の妥当性が示されたので,続いて実際の建物壁に設け られた窓モデルによる散乱についての解析を示す.誘電 体は,一般的に窓ガラスに用いられるソーダガラスを想 定し,自由空間法 [11] を用いた実測から得られた結果か



図 2: 損失のない誘電体が開口内部に全装荷された厚みの あるスリットによる遠方回折界. kb = 2.00, $kb = kb_2 = 2.00$, $kb_1 = 0$, $\theta_0 = 50.0^\circ$, $\varepsilon_r = 3.00$, $\mu_r = 1.00$.

ら, $\varepsilon_r = 7.50$ とした.以降の数値計算例では,窓ガラス は厚みのある壁の中心に装荷されているものとし,回折 パターンを比較している結果の最大 dB 値で規格化して表 す.また,携帯電話の使用周波数を想定し,周波数 f を 1.00 GHz(自由空間波長 $\lambda = 300$ mm)とする.

図4に,窓幅*a*を1000 mm (= 3.33λ),2000 mm (= 6.67λ),3500 mm (= 11.6λ)と変化させた場合の 遠方回折界を示す.壁厚*b*を150 mm,窓ガラスの厚み *b*₂ - *b*₁を5.00 mm とし,入射角 $\theta_0 = 50^\circ$ で,屋外から 窓へ入射した場合を考える.これらの周波数を用いた場 合,開口幅が波長に対して十分大きくなり,参照解とし て使用した KP 法による解析は困難となる.影境界を与 える主反射・透過方向($\theta = \pi \mp \theta_0$)に強く回折され,窓 幅が大きい程回折量が増加する傾向となった.

図5は窓ガラスの厚みを変化させた場合の回折パター ンである.ガラスが厚いほど,屋内側への透過量が減少 し,屋外側ではやや増加する傾向がある.窓ガラスの厚



図 3: 損失のある誘電体が開口内部に全装荷された厚みの あるスリットによる遠方回折界. ka = 30.0, kb = 2.00, $kb = kb_2 = 2.00$, $kb_1 = 0$, $\theta_0 = 50.0^\circ$, $\varepsilon_r = 3.00 + i4.00$, $\mu_r = 1.00$.

みは通常 5 mm (= 0.0167λ) 程度と波長に比べて十分小 さいため,ガラスの有無による影響は小さく,影境界方 向におけるパターンの大きな変化は見られない.

4. 結論

GTD を利用して,建物壁に設けられた窓による平面波 の回折について解析した.窓を模擬した厚みのあるスリッ ト開口部に誘電体層を装荷した問題として定式化し,最 初にその解析手法の妥当性を他解法と比較することによっ て確認した.次に携帯電話の使用周波数を想定した数値 計算により,建物壁や窓ガラスの厚みが,波長に対して十 分薄くなるので,窓ガラスの装荷されていない,中空ス リットによる平面波回折の解析によっても,回折パターン 等の概要が推定できることが示された.今後は,本手法 を拡張して三次元構造をした方形窓が単独で,あるいは 複数存在する場合についての解析を進める予定である.

謝辞

本研究を行うにあたり,本学理工学部 白井宏教授から 承った親切なるご指導,ご鞭撻に対し,謹んで御礼申し 上げます.また,有益な解析データ及び御助言を承りま した,新潟大学教育人間科学部 佐藤亮一教授に心より深 謝いたします.

本研究の一部は,平成27年度日本学術振興会科学研 究費補助金基盤研究(C)15K06083および,中央大学基礎 研究費の助成を受けて行われた.



図 4: 窓幅が遠方回折界に及ぼす影響. f = 1.00 GHz, $\theta_0 = 50.0^\circ$, b = 150 mm, $b_2 - b_1 = 5.00$ mm, $\varepsilon_r = 7.50$, $\mu_r = 1.00$. ——: a = 1000 mm; - - -: a = 2000 mm; · · · : a = 3500 mm.

参考文献

- Y. Nomura and S. Katsura, "Diffraction of electromagnetic waves by ribbon and slit. I," Journal of Phys. Soc. Japan, vol.12, no.2, pp.190–200, Feb. 1957.
- [2] S. N. Karp and A. Russek, "Diffraction by a wide slit," J. Appl. Phys., vol.27, no.8, pp. 886–894, Aug. 1956.
- [3] J. J. Bowman, T. B. A. Senior and P. L. E. Uslenghi eds., Electromagnetic and acoustic scattering by simple shapes, Hemisphere Publ., New York, 1969.
- [4] J. B. Keller, "Geometrical theory of diffraction," J. Opt. Soc. Am., vol.52, no.2, pp.116–130, Feb. 1962.
- [5] K. Hongo and G. Ishii, "Diffraction of an electromagnetic plane wave by a thick slit," IEEE Trans. on Antennas Propag., vol.AP-26, no.3, pp.494–499, May 1978.
- [6] H. Shirai and L. B. Felsen, "Rays, modes and beams for plane wave coupling into a wide open-ended parallel plane waveguide," Wave Motion, vol.9, no.4, pp.301–317, July 1987.



図 5: 窓ガラスの厚みが遠方回折界に及ぼす影響. f = 1.00 GHz, $\theta_0 = 45.0^\circ$, a = 2000 mm, b = 150 mm, $\varepsilon_r = 7.50$, $\mu_r = 1.00$. ××: ガラスなし; —: $b_2 - b_1 = 5.00$ mm; - -: $b_2 - b_1 = 10.0$ mm; ···: $b_2 - b_1 = 20.0$ mm.

- H. Shirai and R. Sato, "High frequency ray-mode coupling analysis of plane wave diffraction by a wide and thick slit on a conducting screen," IE-ICE Trans. on Electron., vol.E95–C, no.1, pp.10– 15, Jan. 2012.
- [8] H. Shirai, M. Shimizu, and R. Sato, "Hybrid raymode analysis of E-polarized plane wave diffraction by a thick slit," IEEE Trans. on Antennas Propag., vol.64, no.11, pp.4828–4835, Nov. 2016.
- [9] H. Y. Yee, L. B. Felsen, and J. B. Keller, "Ray theory of reflection from the open end of waveguide," SIAM J. Appl. Math., vol.16, no.1, pp.268– 300, Mar. 1968.
- [10] H. Shirai, Y. Matsuda, and R. Sato, "GTD analysis for evanescent modal excitation," IEICE Trans. on Electron., vol.E80–C, no.1, pp.190–192, Jan. 1997.
- [11] A. N. Nguyen and H. Shirai, "A Free Space Permittivity Measurement at Microwave Frequencies for Solid Materials," IEICE Trans. on Electron., vol.E100–C, no.1, pp.52–59, Jan. 2017.